(12)铃路協力会的に登づいて公開された回廊出題

(19) 世界知的所有知识的 国际事态局



(43) 国際公開日 2005 年4 月21 日 (21.04.2005)

PCT

(10) **西藤公開香号** WO 2005/036626 A1

(51) 国贸特路分强":

······

(21) 國際出西行今:

H01L 21/22, 21/265 PCT/JP2004/015308

(22) 國際出頭日:

2004年10月8日(08.10.2004)

(25) 国歴出題の日語:

日卒蹈

(26) 国際公開の冒路:

日本昭

(30) 賢先衛データ:

特四2003-350368

2003年10月9日 (09.10.2003) J

(71) 出質人 (共図を除く金ての指定回について): 後下図 母産具株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUS-TRIAL CO., LITD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大 字門真 1 0 0 6 登地 Osaka (JP).

(72) 兌明容; および

(75) 発明省/出囲人 (共国についてのみ): 佐々木 雄一朗 (SASAKI, Yuichiro). 金 成園 (JIIN, Cheng-Guo). 水野 文二 (MIZUNO, Bunji).

(74) 代理人: 小豆 昌平 、外(OGURI, Shohei et al.); 〒 1076013 口京都沿路赤坂一丁目 1 2 查 3 2 号アーク 愈ピル 1 3 単 発光管許平高所 Tokyo (JP).

(81) 쓂定函 (盗示のない限り、全ての私國の國内保配が可強): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

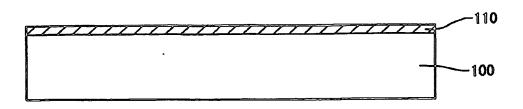
(84) 滑定国 (登示のない思り、全ての犯頭の広紀録別が可強): ARIFO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公閱①環: — 國際關查報告①

2文字コード及び他の略暦については、定簿発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲録されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(\$4) Title: JUNCTION FORMING METHOD AND OBJECT TO BE PROCESSED AND FORMED BY USING SAME

(54) 発明の名称: 統合の形成方法およびこれを用いて形成された欲処理物



(57) Abstract: A method for forming a shallow junction with high accuracy and with a high throughput in a simple step. A state of the surface of a substrate suitable for the wavelength of an electromagnetic wave to be applied is set up. Thereafter, the electromagnetic wave is applied to electrically activate impurities so that the excitation energy is efficiently absorbed in an impurity thin film. Thus, a shallow junction is efficiently formed.

2005/036626 A1 II